NAIST-IS-MT1551071

修士論文

正対する放物面鏡を利用した

狭被写界深度撮影システム

西 諒一郎

2017年3月16日

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

本論文は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科に 修士(工学)授与の要件として提出した修士論文である。

西 諒一郎

審査委員:

横矢 直和 教授	(主指導教員)
向川 康博 教授	(副指導教員)
佐藤 智和 准教授	(副指導教員)
河合 紀彦 助教	(副指導教員)

正対する放物面鏡を利用した

狭被写界深度撮影システム*

西 諒一郎

内容梗概

狭被写界深度撮影はフォーカスを合わせた特定の奥行き範囲の物体のみを鮮明 に撮影する方式であり,前景背景分離や半透明物体の内部構造の解析などに使用 される.被写界深度の浅い光学装置としては顕微鏡が代表的である.しかし,顕 微鏡は細胞などの微小物を撮影対象としており,一般的な大きさの物体を同様に 撮影できる開口数の大きなレンズを作成することは困難である.このような問題 に対して,複数台のカメラまたはミラーを用いることで仮想的に開口数を大きく する合成開口法が提案されている.しかし,複数台のカメラを用いる場合にはカ メラセッティングやキャリブレーションが複雑で時間がかかる問題がある.ミラー を用いた場合には,精密に位置あわせをする必要があり,一台のカメラによって 複数視点からの画像を取得するため解像度が低下する問題が残されている.

本研究では、2枚の放物面鏡を向かい合わせに設置した撮影装置の開発および、 その特徴を利用した画像の鮮明化処理により、非常に浅い被写界深度の撮影を実 現する.本装置は一般的なレンズを用いず、撮像素子を露出したカメラ1台と2 枚の放物面鏡を用いることで、カメラセッティング時間が不要で、ミラーを用い る手法と比べて解像度の高い画像を取得することが可能である.また、本装置特 有の撮影対象の位置に依存したぼけ方を示す点拡がり関数(PSF)を利用するこ とで、より鮮明な特定層のみの画像を取得することができる.実験では、シミュ レーション環境において、層構造物体の特定層にフォーカスを合わせた撮影を行

^{*}奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 修士論文, NAIST-IS-MT1551071, 2017 年 3月 16日.

い,提案装置が浅い被写界深度を持つことを示す.次に,計測した PSF を利用した最適化を用いて,より鮮明な特定層抽出を行う.また,実環境でも同様の実験を行うために,プロトタイプ装置を試作し,撮影装置が非常に浅い被写界深度を実現できることを確認する.最後に,PSF を利用した最適化を行うことで鮮明な特定層の画像を抽出できることを確認するとともに,シミュレーションと実環境実験における結果の差異とその原因について考察する.

キーワード

狭被写界深度撮影,放物面鏡,高開口,点拡がり関数,鮮明化処理

Ultra Shallow DoF Imaging System by using a Pair of Faced Paraboloidal Mirrors^{*}

Ryoichiro Nishi

Abstract

Shallow DoF (Depth-of-Field) imaging highlights a target in a photograph by de-focusing undesired objects that exist outside a certain depth range. It can be used for generating a foreground/background discriminated image and analyzing the inner structure of a translucent object. A microscope is a typical device for shallow DoF imaging. However, the target objects are limited to tiny ones like cells. It is almost impossible to produce lenses for shallow DoF imaging for standard size objects. To solve this problem, a variety of synthetic aperture methods have been investigated and are classified into two categories: One physically captures images from multiple viewpoints using only standard cameras and the other virtually generates multiple viewpoint images using a camera and multiple mirrors. However, the former requires time-consuming camera calibration or complex multi-camera devices. In the latter category, the resolution of the synthesized image is quite low because all images captured by multiple virtual cameras are recorded as a single image in reality.

This thesis proposes a novel imaging device that consists of a pair of faced paraboloidal mirrors and a method to sharpen an image using the characteristics of the device to achieve ultra-shadow DoF imaging. The key optical device of our system consists of a pair of faced paraboloidal mirrors and a lens-less camera without using a general lens. The proposed device does not require time-consuming

^{*}Master's Thesis, Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, NAIST-IS-MT1551071, March 16, 2017.

calibration unlike multiple camera-based methods, and preserves the higher resolution than multiple mirror-based methods. In addition, the proposed method takes a clear image of a specific layer by optimization using position-dependent point spread functions (PSFs). In experiments with a simulation environment, first, in order to show that the proposed device achieves ultra-shallow DoF imaging, we capture specific layers of layered objects which have narrow empty gaps between each layer. Next, we decompose the captured images into respective layers by the optimization using measured PSFs of our device. In order to check the performance of the proposed method in real environments, we make a prototype device and show that our system achives ultra-shallow DoF imaging by comparing images captured by the proposed device and a camera with a relatively shallow DoF lens. In addition, we remove blurs on captured images using measured PSFs of the prototype device. Finally, we discuss the difference in experimental results between the simulation and real environments.

Keywords:

ultra-shallow DoF imaging, paraboloidal mirror, High aperture, point spread function, decomposition

目 次

1.	はし	じめに	1
2.	狭裓	と写界深度撮影撮影に関する従来研究と本研究の位置づけと方針	4
	2.1	撮影手法の工夫により特定層の抽出を行う方法	4
		2.1.1 複数視点の画像を利用する手法	4
		2.1.2 PSF を利用したデコンボリューション手法	7
	2.2	光源の工夫により特定層抽出を行う方法	7
		2.2.1 顕微鏡を用いた手法	8
		2.2.2 高周波照明を用いた手法	9
	2.3	本研究の位置づけ	9
3.	正対	する放物面鏡を用いた狭被写界深度撮影	12
	3.1	提案手法の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	3.2	提案手法の被写界深度	13
4	位置	명나는 DGD 수 미나는 비망국는 나는 조박스 모바스	
т.		『依存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定	18
т.	4.1	電磁存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定	18 18
1.	4.1 4.2	■依存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約	 18 20
1.	4.1 4.2 4.3	■依存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理	 18 20 21
5.	业 4.1 4.2 4.3 提案	■低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理	 18 20 21 24
5.	业 4.1 4.2 4.3 提案 5.1	 低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 等法による撮影実験 シミュレーション環境実験 	 18 20 21 24 24
5.	也僅 4.1 4.2 4.3 提案 5.1	低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件	 18 18 20 21 24 24 24
5.	也 4.1 4.2 4.3 提案 5.1	低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件 5.1.2 PSFの取得	 18 18 20 21 24 24 24 25
5.	4.1 4.2 4.3 提案 5.1	低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件 5.1.2 PSFの取得 5.1.3 実験結果	 18 18 20 21 24 24 24 25 29
5.	4.1 4.2 4.3 提案 5.1	低存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件 5.1.2 PSFの取得 5.1.3 実験結果 実環境実験	 18 20 21 24 24 24 25 29 35
5.	4.1 4.2 4.3 提案 5.1	1位宿依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件 5.1.2 PSF の取得 実環境実験	 18 20 21 24 24 24 25 29 35 37
5.	4.1 4.2 4.3 提案 5.1	個人存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像推定 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理 手法による撮影実験 シミュレーション環境実験 5.1.1 実験条件 5.1.2 PSF の取得 支援結果 5.1.3 実験結果 5.2.1 撮影装置と方法 5.2.2 PSF の取得	 18 20 21 24 24 24 25 29 35 37 38

5.3 シミュレーション環境実験と実環境実験の差異についての考察	45
6. まとめ	46
謝辞	47
参考文献	48

図目次

1	開口数の違いによる被写界深度の変化	2
2	複数視点からの撮影による高開口撮影	5
3	複数台のカメラを用いた合成開口撮影システム.......	6
4	ミラーアレイによる合成開口撮影システム	6
5	レンズアレイによる合成開口撮影システム	6
6	共焦点撮像法の撮影原理	8
7	2枚の向かい合わせ放物面鏡	10
8	放物面鏡を用いたプロトタイプ撮影装置	12
9	放物面鏡の特徴	13
10	提案手法による撮影原理	13
11	向かい合わせ放物面鏡に用いる座標系の設定........	14
12	向かい合わせ放物面鏡の開口数	14
13	PSF によってボケる撮影対象と撮影画像の関係	19
14	複数枚の撮影画像を用いた撮影画像の特定層抽出	20
15	撮像素子によって観測される光線強度	21
16	実環境実験において撮影に使用する撮像素子........	22
17	撮像素子前面のカバーガラスの有無による撮影画像の差	23
18	撮像素子前面にカバーガラスが無い場合に計測される PSF 形状 .	23
19	撮像素子前面にカバーガラスがある場合に計測される PSF 形状 .	23
20	POV-RAY による撮影シミュレーション	25
21	シミュレーション環境での撮影装置の概要	26
22	撮影装置の平面図および側面図	26
23	焦点から Z 軸方向に点光源を移動させたときに観測される PSF の	
	形状(左図:U 軸方向の PSF の断面図,右図:観測された PSF)	28
24	焦点から X 軸方向に点光源を移動させたときに観測される PSF の	
	形状(左図:U 軸方向の PSF の断面図,右図:観測された PSF)	28
25	各位置で観測された PSF の周波数成分	29
26	シミュレーション環境実験に使用する撮影対象........	30

27	提案撮影装置による撮影結果	30
28	各層に焦点を合わせて撮影した2枚の撮影画像を用いた鮮明化処	
	理結果	31
29	撮影対象画像と2枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果との誤差.	31
30	最適化に用いる画像の撮影位置	32
31	各層とその前後の奥行きに焦点を合わせて撮影した5枚の撮影画	
	像を用いた鮮明化処理結果.................	34
32	撮影対象画像と5枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果との誤差.	34
33	構築した提案プロトタイプ撮影システム	36
34	比較対象として使用するレンズを用いた撮影システム.....	36
35	提案プロトタイプ撮影システムの構成	37
36	PSF 取得に用いる撮影対象	38
37	PSF の取得方法	38
38	PSF の計測範囲と PSF 計測に用いる OHP シートに印字する点の	
	サイズ	39
39	実環境実験において取得した PSF	40
40	撮影対象の移動に使用するロボットアーム	40
41	実環境撮影実験に使用する撮影対象	41
42	撮影対象1の撮影結果	42
43	撮影対象2の撮影結果	42
44	撮影対象3の撮影結果	43
45	鮮明化処理実験の撮影対象として用いる2層構造物体......	44
46	鮮明化処理実験に用いる撮影画像	44
47	鮮明化処理結果	45

表目次

1	顕微鏡に用いられるレンズと提案手法の開口数の比較	 15
2	通常の撮影に用いられるレンズと提案手法の F 値の比較	 16

3 撮影対象の各層の画像と鮮明化処理による推定画像の類似度 ... 35

1. はじめに

被写界深度は撮影対象に焦点を合わせた際にその距離の前後部分のボケずに鮮 明に撮影される範囲であり,浅い被写界深度を持つ光学装置を用いた撮影では, フォーカスを合わせた位置のみが鮮明に撮影され、その他の領域はボケて撮影さ れる. 開口数はレンズの性能を示す指標で, 撮影装置によって取得できる光線の 最大角度を表しており,開口数が大きくなると被写界深度が浅くなる関係がある. 通常のカメラでは絞りによって開口数を変化させるためF値を変化させることで 被写界深度を制御することが可能である. 図1は撮影対象の檻の中のぬいぐるみ に焦点を合わせて撮影を行った際のレンズの開口数の違いによる光線の経路を示 している. 図1(a)は開口数が小さいため, 焦点の合っていない檻から出た光もぬ いぐるみから出た光と似た軌跡を通り,撮像素子面上に集光しているが,図1(b) に示す開口数の大きいレンズを用いたときには、檻から出た光は撮像素子面上で 集光しないため, 撮影画像には大きくボケて撮影される. このため開口数のより 大きいレンズを用いることで特定の層のみが強調された画像を得ることが可能で あり、前景背景分離や半透明物体の内部構造の解析などに利用することが可能で ある. 顕微鏡は非常に浅い被写界深度を持つ代表的な撮影装置であり, 特定位置 に集光するようなレーザを光源に使用する共焦点撮像法 [1, 2, 3] を用いることで 特定の位置のみを撮影することができ、細胞の立体的な構造の撮影も可能となる. しかし、顕微鏡が対象とする撮影物体は細胞のような非常に小さいものに限られ ている. 撮影対象を大きくするためには大口径レンズを必要とするが, 大口径で 開口数の大きいレンズを作成することは困難である.

これらの問題を解決するために,複数の視点から撮影した画像を利用すること で,特定の奥行きにある撮影対象のみを撮影する合成開口法が提案されている. 合成開口法はカメラを複数台使用する手法 [4,5] とミラーやレンズアレイを用い て複数視点からの画像を取得する手法 [6,7,8,9,10,11] に大別される.前者は, 通常のレンズを取り付けた複数台のカメラを利用して,多視点からの画像を取得 することで特定の奥行きにある物体のみを撮影することが可能である.しかし, 複数台のカメラを使用するため,それぞれのカメラの位置を正確に合わせる必要 があり,複雑なシステムを構築するために時間がかかるといった問題がある.後

1





(b) 開口数の大きいレンズを用いた撮影

者は、ミラーやレンズによって複数視点の画像を取得するため、1台のカメラで 撮影することが可能であり、撮影システムの複雑さは軽減されているが、ミラー やレンズとカメラの位置関係を精密に調整する必要があることや、1台のカメラ によって複数視点からの画像を取得するため解像度が低下する問題がある.

本研究では、正対する2枚の放物面鏡と撮像素子をむき出しにした状態のカメ ラを利用して非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置を開発し、その撮影装置が持 つボケ特性を利用した画像の鮮明化処理により、層構造物体の特定層のみを分離 して取得できる撮影システムを提案する.提案装置は一般的なレンズを用いず、 撮像素子を露出した1台のカメラと2枚の放物面鏡を用いることで、撮影システ ムが単純であり、ミラーやレンズアレイを用いる手法と比べ複数視点の画像を1 つのカメラで分割しないため、高い解像度の画像が得られるという特徴を持つ. また、撮影装置特有の位置に依存したボケ方を示す点拡がり関数(PSF)を利用

図1 開口数の違いによる被写界深度の変化

した、より鮮明な特定層のみの画像の抽出を行うための最適化処理を提案する.

以下,2章では,特定の奥行きのみを撮影する手法についての関連研究と本研 究の位置づけについて述べる.3章では,本研究で提案する撮影装置について述 べ,撮影システムの構成と撮影環境について述べる.また,提案する撮影装置の 特徴と性能についても述べる.4章では,提案装置の持つ位置依存 PSF を用い た,鮮明な特定の奥行きの画像を推定するための最適化手法について述べる.5 章では,シミュレーション環境で2層構造物体を撮影対象とし,提案撮影装置に よってそれぞれの層に焦点を合わせて撮影を行う.また,位置依存 PSF に基づく 鮮明化処理により,特定の奥行きの画像のみが推定可能であることを確認する. 実環境では,撮影システムを試作し,間隔の狭い2層の物体を撮影対象として撮 影実験を行い,狭被写界深度撮影が実現できていることを確認する.また,PSF の計測を行い,最適化処理を用いることで特定の奥行き画像のみの推定を行い, シミュレーション環境と実環境の差異とその原因について考察を行う.6章では, まとめと今後の課題について述べる.

2. 狭被写界深度撮影撮影に関する従来研究と本研究の

位置づけと方針

本研究では、非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置を提案する.また、提案装置特有の位置依存 PSF を用いて、特定の奥行きに存在する物体のみが表れた画像を推定する手法についても提案する.特定の位置・奥行きの画像を得るための従来手法は、撮影システムを直接工夫する手法と撮影を行う際に用いる光源を工夫する手法の2つに大別できる.本章では特定の奥行きの画像を取得する従来研究について概観し、従来研究に対する本研究の位置づけと方針について述べる.

2.1 撮影手法の工夫により特定層の抽出を行う方法

被写界深度の浅い撮影装置を実現するために,複数視点で撮影した画像を利用 することで仮想的に開口数を大きくする合成開口法が提案されている.また,撮 影装置特有の奥行き方向に依存する PSF を用いて撮影画像から奥行きを推定す ることで,特定の奥行きのみの画像を抽出する手法も提案されている.以下に, それぞれの撮影手法の特徴と問題点を述べる.

2.1.1 複数視点の画像を利用する手法

合成開口法は複数視点から撮影した画像を利用することで仮想的に開口数を大 きくし,浅い被写界深度撮影を行う手法である.複数視点からの画像を得る手法 として,図2(a)に示すカメラを複数の位置に設置して撮影した画像を用いる手 法[4,5]と図2(b)に示す複数枚のミラー[6,7,8,9]を用いた手法やレンズアレイ [10,11]を用いて複数視点の画像を取得する手法に大別することができる.

実際に複数台のカメラを設置して撮影する手法は、カメラの配置によって大き い開口数を得ることができ、撮影対象の大きさに制限がないという特徴を持つ. Vaish ら [4] は図 3 のような撮影装置を用いて、茂みの後ろに隠れた人の撮影を 行っている.しかし、この撮影システムは複数台のカメラを利用するため、シス テムが複雑になりカメラキャリブレーションやセッティングに時間がかかること



図2 複数視点からの撮影による高開口撮影

が問題である.また,カメラを動かしながら動画を撮影することで多視点からの 画像を取得し,特定の奥行きのみの画像を抽出する手法[12]では,1台のカメラ で前景背景分離を行うことができるが,カメラの位置を正確に推定する必要があ り,また,それぞれの視点位置での画像に時間的なずれが生じるといった問題が ある.

1台の通常のカメラとミラーやレンズを用いた撮影手法では,撮影システムは 複雑にならず,1度で撮影することが可能である.田川ら [9] は図4(a) に示すよう に複数枚のミラーを楕円体に沿うように配置した亀甲多面鏡を利用した180度の 開口をもつ撮影手法を提案し,撮影対象がメッシュによって遮蔽された場合でも 特定の奥行きのテクスチャのみを撮影できることを示している.また,レンズア レイを用いた撮影装置としてはLYTROなどが製品化されており,ライトフィー ルドの保存などに使用されている [13, 14].この手法を用いた撮影では,図5の ように撮像素子上にそれぞれのレンズで結像した画像が保存されるため,仮想的 に大きい開口数を持つ撮影が可能である.しかし,撮影される1枚の画像の中に 複数視点の画像が分割されて取得されるため,解像度が低くなるといった問題が あり,ミラーアレイやレンズアレイと撮像素子の位置関係も正確に合わせる必要 がある.

5



(a) カメラアレイ撮影システム (b) 通常のカメラによる撮影 (c) 複数視点の合成画像 図 3 複数台のカメラを用いた合成開口撮影システム



(a) ミラーアレイ





レイ (b) 1視点からの画像 (c) 40視点からの合成画像

図4 ミラーアレイによる合成開口撮影システム



(a) 撮影画像



(b) レンズアレイを用いた高開口撮影原理



2.1.2 PSF を利用したデコンボリューション手法

通常のカメラでは焦点を合わせた位置と異なる位置にある撮影対象はボケて撮 影される.この撮影対象がボケて撮影された画像をボケの無い画像に復元するた めに、PSFを利用したデコンボリューション手法が利用されている[15].しかし、 撮影対象の奥行き方向の位置に依存して PSF の形状が変化するため、1 種類の PSFを用いたデコンボリューションでは正しい復元が行えない.そこで、撮影を 行う際に撮像素子を動かすフォーカススイープ撮影[16,17]や、カメラを動かし ながらシャッターの開閉タイミングを制御する手法[18]では、位置に依存しない 特殊な PSF を持つ撮影装置を構築し、1 種類の PSF を用いたデコンボリューショ ンにより全焦点画像の取得を行う.

また,撮影対象の奥行き方向の位置に対応した PSF を用いるデコンボリュー ション手法は,画像のボケ度合いから画像の奥行き情報を取得することと等価で あり,Depth from Defocus (DFD) [19, 20] と呼ばれる.通常のカメラを用いた 場合,奥行きに対して PSF の変化は緩やかであるため,ボケの形状から正確な 奥行き推定することは困難であるが,撮影に用いる絞りの形状をマスクによって 変化させることで,奥行き方向の位置に依存した形状を持つ PSF を得られるよ うに絞りを調節し,特定の奥行きの情報のみを取得する手法が提案されている [21, 22, 23].しかし,間隔の狭い撮影対象の場合,カメラレンズの開口数は小さ いため,奥行きの差による PSF 形状の変化があらわれず,奥行きごとの画像を取 得することは困難である.

2.2 光源の工夫により特定層抽出を行う方法

撮影に用いる光源および撮影装置を工夫することで,特定の位置・奥行きの画 像を観測することができる.本節では,顕微鏡に用いる光源を工夫することで特 定の位置のみの情報を取得する手法と撮影対象に高周波パターンを投影し特定の 奥行きのみの画像を推定する手法について概要と特徴を述べる.



図 6 共焦点撮像法の撮影原理

2.2.1 顕微鏡を用いた手法

顕微鏡の光源を工夫する手法では,撮影対象に対して一点のみに集光するよう にレーザを照射する共焦点撮像法 [1, 2, 3] と撮影対象に対して,横方向から光を 照射することで撮影対象の散乱光を観測する暗視野観察法 [24, 25] と呼ばれる手 法の2種類が挙げれられる.

前者の共焦点撮像法は光源にレーザを用いて撮影対象の特定の一点のみに集光 するように照射することで,焦点の合っている位置のみ際立って明るく撮影され るという特徴を持っている.図6は共焦点撮像法の概略を示したものであり,レー ザ光はビームスプリッターにより撮影対象上に集光するように照射される.この とき撮影側の対物レンズにより集光する位置にピンホールを用意することで,撮 影対象の特定の一点で反射された光のみがピンホールを通過し撮像素子によって 撮影されるため,非常に狭い範囲の一点のみの情報を取得することが可能となる. 走査型レーザ共焦点顕微鏡は光源の集光位置を走査させながら撮影することで3 次元情報の取得を行うため,細胞の立体的な構造の解析や表面形状測定などに利 用されている.しかし,特定の奥行きにある面の画像を取得するためには,走査 いて同時に撮影する手法 [3] も提案されているが,一度に平面上の全ての点を撮 影することはできない.

後者の暗視野観察法は光が直接対物レンズに入射しない角度から光源を照射す ることで,撮影対象の散乱光を撮影する手法である.光源が集まる点のみが際立っ て明るく撮影されるため,光の集まる特定の範囲のみを撮影することが可能とな る.しかしながら,共焦点撮像法と同様に,特定の一点しか撮影できないため特 定の奥行きにある層の画像を取得するためには走査しながら撮影する必要がある といった問題がある.

顕微鏡を用いた撮影では,対物レンズが高開口撮影を実現するため,特定層の 抽出が可能であるが,大口径大開口のレンズの作成が困難であることから,撮影 対象は細胞のような微細なものに限られるといった問題もある.

2.2.2 高周波照明を用いた手法

高周波照明を用いた手法 [26] では,撮影対象に対してチェスボードのような高 周波な模様のパターンを投影し,撮影された画像のボケ方によって内部構造を解 析する.

この手法では,高周波照明を半透明物体に照射する.内部で反射された光は内 部散乱によってボケ方が大きい画像が撮影されるため,ボケ方の違いから特定の 奥行きに存在する画像のみを撮影することが可能となる.しかし,撮影対象とな る半透明物体の表面は平面である必要があるといった問題があり,撮影対象が光 が内部散乱を起こす半透明物体で構成されている必要がある.

2.3 本研究の位置づけ

開口数の大きいレンズを利用することで非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置 を実現することができる.高開口の対物レンズを用いた顕微鏡は非常に浅い被写 界深度を持つ撮影装置として代表的であり,2.2.1項で述べた共焦点撮像法や暗視 野観察法を用いることで特定の位置のみを撮影することが可能である.しかし, 被写界深度が浅い大口径のレンズを作成するためには製造するための坩堝のサイ



図72枚の向かい合わせ放物面鏡

ズに限りがあることや、ガラス内部に気泡が入り撮影精度にムラができるなどの 問題により作成が困難であることから、細胞のような非常に微細な生物などの撮 影対象に制限される.また、レンズの内部を中空にすることができないため、レ ンズの厚みにより最大開口数が制限されるといった問題もある.2.1.1項で述べ た合成開口法は、カメラの位置やミラー・レンズの位置を工夫することで撮影対 象の大きさを制限せず、非常に浅い被写界深度を得ることができる.しかしなが ら、複数台のカメラを用いる手法では、カメラ間の位置関係を正確に合わせる必 要があるためセッティングに時間がかかることや、ミラーやレンズを用いた手法 では、カメラとの位置関係を精密に調整する必要があり、さらに合成画像の解像 度が低下するという問題もある.2.2.2項で述べた平行高周波照明を利用した撮影 方法では、照明を工夫することで撮影対象の奥行き推定が可能であるが、半透明 物体のような散乱媒介中に存在する必要がある.

そこで、本研究では向かい合わせに設置した放物面鏡を用いて撮影を行うこと で非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置を提案する.2枚の向かい合わせ放物面 鏡は"Mirage"や"ボルマトリクス"と呼ばれ、図7のように内部に配置した物体 が浮き出て見える玩具として知られている[27].Butlerら[28]はこの"Mirage"を 利用することで、浮き出た映像を直接指で操作するディスプレイの提案を行って いる.本研究で提案する撮影手法は、一方の放物面鏡の焦点から出た光はもう一 方の放物面鏡の焦点に集光させるという特徴を用いて、撮影対象から出た光を撮 像素子上に集光させることで撮影を行う.このとき、放物面鏡の幅と焦点距離の 関係から開口数を決められることから, 焦点距離に対し放物面鏡幅を大きくする ことで大開口の撮影装置が設計可能である. 放物面鏡はフーコーテスト [29] など の表面検査法が提案されたことで,非常に高い精度の鏡を作成することが可能と なり,レンズを用いた撮影装置より大口径の撮影装置を作成することができるた め,撮影対象の大きさに対する制限が小さいことも特徴の一つである. また,提 案撮影手法では,合成開口法と異なり,撮影装置は複数台必要になることや,複 数視点からの画像を1台のカメラで分割して撮影する手法のように解像度が下が るといった問題を解消することできる.

提案する撮影装置は奥行き方向のボケ方が大きく変化し, 焦点を合わせた面と 異なる奥行きの撮影対象は大きくボケるため, 特定の奥行きに存在する画像のみ を撮影することが可能となる.しかし, 一般的な撮影装置と比べて幾何収差の影 響が大きくあらわれ, 撮影画像の焦点から離れた位置ではボケが発生する.そこ で本研究では, 2.1.2 項で述べたような奥行き方向に依存した PSF を用いた奥行 き画像の取得を行うだけでなく. 位置に依存した PSF を用いることで幾何収差に よるボケも取り除き,より鮮明に特定層の抽出を行う鮮明化処理の提案も行う.

3. 正対する放物面鏡を用いた狭被写界深度撮影

本研究では正対する2枚の放物面鏡と撮像素子を用いて撮影を行う.本章では, 放物面鏡の持つ特徴を利用した撮影方法について述べる.また,開口数とF値, 被写界深度を算出し,非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置であることを示す.

3.1 提案手法の概要

本研究では、図8に示す向かい合わせに設置された2枚の放物面鏡と一般的な レンズを用いない撮像素子を露出したカメラ1台を用いて撮影を行う撮影装置を 提案する.放物面鏡の特徴として図9(a)に示すように、焦点を通る光は放物面鏡 によって平行光として反射され、平行光は図9(b)に示すように焦点に集光するよ うに反射する.このため、図10に示すように、同形状の放物面2枚を向かい合 わせに設置すると一方の放物面鏡の焦点から出た光は、もう一方の放物面鏡の焦 点に結像する.本研究では一方の放物面鏡の焦点に撮影対象を設置し、もう一方 の放物面鏡の焦点位置に撮像素子を設置することで撮影を行う.本撮影装置では 焦点距離に対し幅が広い放物面鏡を用いることで高開口撮影を行い、非常に浅い 被写界深度の撮影を実現する.また、提案する装置ではそれぞれの放物面鏡の頂 点に穴を開けることで撮像素子と撮影物体を設置し、装置内部の中央付近にマス クを設置することによって、撮影対象から出た光が放物面鏡での反射なしに直接 撮像素子に入射することを防止する.



図8 放物面鏡を用いたプロトタイプ撮影装置



図 10 提案手法による撮影原理

3.2 提案手法の被写界深度

提案する撮影装置の放物面鏡の幅と焦点位置の関係から,開口数とF値,被写 界深度を算出する.開口数は光を集光できる範囲を示しており,F値はレンズの 焦点距離と有効口径の関係を示す指標である.被写界深度は撮影対象に焦点を合 わせた際,撮影対象がボケずに撮影される範囲を示しており,開口数が大きくな るとF値は小さくなり被写界深度が浅くなるという関係を持っている.

はじめに,開口数を算出するために図11に示す座標系を設定する.放物面鏡の撮影対象を設置する焦点位置を原点とし,Z軸は2枚の放物面鏡の焦点を通る 奥行き方向を示し,X軸およびY軸は撮像素子に対して水平方向を示す.このと き,X軸とY軸,Z軸は互いに直行している.開口数(NA)は撮像素子によって



図 11 向かい合わせ放物面鏡に用いる座標系の設定



図 12 向かい合わせ放物面鏡の開口数

計測される物体から出た光と光軸との最大角度を示す開口角度 θ および撮影対象 と撮像素子間の媒質の屈折率 n を用いて以下の式により算出することができる.

$$NA = n\sin\theta \tag{1}$$

本研究で提案する撮影装置では、光は空気中のみを通過するため媒質の屈折率を 示す*n*は"1"となり、開口数は以下の式に簡略化される.

$$NA = \sin\theta \tag{2}$$

開口数 sin θ は, 図 12 に示されるように放物面鏡の幅 w と焦点距離 l から求める ことができる.

$$\sin \theta = \frac{\frac{w}{2}}{\sqrt{\left(\frac{w}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}}.$$
(3)

表1 顕微鏡に用いられるレンズと提案手法の開口数の比較

開口数	レンズの種類	商品名		
0.94	ミラー	提案手法		
1.25	対物レンズ(100 倍・液侵)	WRAYMER GLF-ACH100XOil		
0.85	対物レンズ(60 倍)	WRAYMER GLF-ACH40X		
0.65	対物レンズ(40 倍)	WRAYMER GLF-ACH60X		

また,放物面鏡の定義した座標系の y=0 における断面の式は焦点距離 *l* を用いて 以下のように表すことができる.

$$4lz = x^2 \tag{4}$$

このとき,撮影装置に利用する2枚の放物面鏡が同じ形状であり,2枚向かい合わせ放物面鏡の一方の焦点位置と,もう一方の放物面鏡の頂点位置が一致しているため,式(4)より,放物面鏡幅wと焦点距離lの関係を表すことができる.

$$4l\left(\frac{l}{2}\right) = \left(\frac{w}{2}\right)^2\tag{5}$$

開口数は式(3)と式(5)より,以下に示すように算出することができる.

$$NA = \sin \theta = \frac{\sqrt{2l}}{\sqrt{2l^2 + \frac{l^2}{4}}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \simeq 0.94.$$
 (6)

表1は顕微鏡で使用される対物レンズの開口数と提案撮影手法の開口数を示している.このことから,顕微鏡に用いられる液浸を用いない対物レンズの開口数 と同等の開口数を持つことが分かり,提案装置が非常に浅い被写界深度を持つこ とが分かる.

次に, F値についての計算を行う.通常のカメラでは開口数ではなくF値を用 いて示すことが多い.これは,通常のカメラでは絞りを用いて開口数を変化させ るため,レンズそのものの性能を示す開口数を使用しないためである.撮影装置 の開口数とF値はどちらも焦点距離を用いて算出され,また,有効口径と開口角

表 2 通常の撮影に用いられるレンズと提案手法の F 値の比較

F値	レンズの種類	商品名
0.18	ミラー	提案手法
0.85	大口径単焦点レンズ	HandeVision IBELUX 0.85/40MM
0.95	単焦点レンズ	SCHNEIDER F0.95 Fast C-Mount Lens
1.40	大口径広角単焦点レンズ	Canon EF35mm F1.4L II USM

度に関係性があるため、以下の式によって開口角度θをF値に変換することが可 能である.

$$F\,\acute{l}tentering = \frac{1}{2\tan\theta} = \frac{\cos\theta}{2\sin\theta} \tag{7}$$

このとき,式(6)の $\sin\theta \simeq 0.94$ より, $\theta = 70.53[deg]$ であることから,提案する 撮影装置のF値は以下の式により求めることができる.

$$F \acute{l}te = \frac{\cos 70.53}{2 \sin 70.53} \simeq 0.177 \tag{8}$$

表2は比較的F値が小さいカメラレンズと提案装置のF値を比較したもので,表 より本研究で提案する撮影装置はF値が非常に小さいことが分かる.

最後に提案する撮影装置の被写界深度を求める.被写界深度 d は撮影対象に 焦点を合わせた際,撮影対象がボケずに撮影される範囲を示し,前方被写界深度 d_{near} と後方被写界深度 d_{far} を用いて以下の式で求めることができる.

$$d = d_{far} - d_{near} \tag{9}$$

撮像素子の1画素は通常一定の面積を持つため,その範囲内でボケが発生して も,被写界深度の範囲内にある撮影対象はボケずに撮影される.前方被写界深度 は撮影対象が焦点から奥行き方向に撮像素子に近づくようにずれた際,撮像素子 によって同じ画像を撮影することのできる,撮像素子から撮影対象までの最小距 離を表す.前方被写界深度は,撮影装置のF値Fとボケの許容範囲c,撮影装置 の焦点距離lを用いて以下の式によって求めることができる.

$$d_{near} = \frac{l^2}{l + 2Fc} \tag{10}$$

また,後方被写界深度は撮影対象が焦点から奥行き方向に撮像素子から遠ざかる ようにずれた際,撮像素子によって同じ画像を撮影することができる,撮像素子 から撮影対象までの最大距離を表す.後方被写界深度は以下の式によって求める ことができる.

$$d_{far} = \frac{l^2}{l - 2Fc} \tag{11}$$

ここで、5.1 節で述べるシミュレーション実験で使用する撮影装置の設定を用いて、画素の直径 $c \ge 10[\mu m] = 0.01[mm] \ge 0$ 、焦点距離 $l \ge 65[mm] \ge 0$ て被写界深度を算出する.提案する撮影手法の F 値は 0.178 であることから、被写界深度は以下のように求めることができる.

$$d = d_{far} - d_{near}$$

$$= \frac{65^2}{65 - 2 \times 0.178 \times 0.01} - \frac{65^2}{65 + 2 \times 0.178 \times 0.01}$$

$$= 65.00354 - 64.99646$$

$$= 0.00707[mm]$$

$$= 7.07[\mu m]$$
(12)

以上より,撮影対象のわずかな奥行き方向のずれによってボケが発生することが 分かる.

4. 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの特定層推定

本研究で提案する撮影装置は、焦点位置と異なる奥行きに存在する対象を大き くぼかして撮影するため、非常に浅い被写界深度を実現できる.しかし、そのボ ケが画像中に残るため、提案する撮影装置だけでは完全に特定の層のみの画像を 取得することは難しい.また、焦点位置と同じ奥行きに存在する撮影対象におい ても、焦点位置から離れるにしたがって少しずつボケて撮影される.

そこで、本研究では提案する撮影装置特有の位置依存 PSF を利用し、最適化 処理を行うことで、撮影対象の特定の奥行きの面のみを推定する.最適化処理で は、推定する画像の輝度値が PSF によって算出できる輝度値を超えず負の値にな らないという2つの条件を用いることでより鮮明な特定層を抽出する.

4.1 節で,撮影画像とPSFによる鮮明な断層画像抽出のための最適化手法の提 案を行う.4.2 節では,最適化手法を適用する際にPSFや光線の特長による制約 について概説し,制約条件を最適化処理に用いることでより鮮明な特定層抽出を 行う手法を提案する.4.3 節では,撮像素子前面に取り付けられたカバーガラス の有無による撮影画像と取得される PSF 形状の変化を示し,撮影装置の特性に より撮影画像与える影響が PSF に含まれていることを確認することで,理想的 な撮影環境と異なる場合にも鮮明化処理が適用できることを示す.

4.1 位置依存 PSF を用いた撮影画像からの層構造物体の各層画像 推定

ある位置kからで出た光 w_k は、位置kに対応する $PSF: \mathbf{p}_k$ によってボケて撮像素子で観測されるため、撮像素子によって撮影される画像 \mathbf{o} は以下の式で表現できる.

$$\mathbf{o} = \sum_{k} w_k \mathbf{p}_k,\tag{13}$$

このとき,撮影画像と撮影対象画像をそれぞれ,縦ベクトルo,w,PSFの行列をPとすると以下の式に置き換えることができる.

$$\mathbf{o} = \mathbf{P}\mathbf{w} \tag{14}$$



図 13 PSF によってボケる撮影対象と撮影画像の関係

図 13 は,撮影画像と PSF によってボケて撮影される撮影対象との関係を示している.

ここで、提案撮影装置は被写界深度が非常に浅く、撮影対象の位置に依存して 大きく変化する PSF を持つため、PSF 行列 P を用いることで、撮影画像 o から、 撮影対象画像 w を求めることができる.ただし、点光源が撮像素子に影響を与え る範囲が狭いため、PSF はゼロの要素を多く持つスパース行列となり、撮影対象 画像 w の一意の解を見つけることは困難である.そこで、以下の式に示すよう に、撮影画像 o と、撮影対象画像にボケを適用した画像 Pw の2 乗誤差が小さく なるような撮影対象画像 w を推定することで鮮明な画像を得る [30].

$$\arg\min \|\mathbf{o} - \mathbf{P} \cdot \mathbf{w}\|^2 \tag{15}$$

このとき,推定する撮影対象の位置に応じた PSF を取得し,撮影対象の位置を 変えながら撮影した複数枚の撮影画像を鮮明化処理に用いることでより鮮明な特 定層抽出を行うことができる.図14は2層構造物体を撮影した際に,各層に焦 点を合わせて撮影した撮影画像と,推定する画像の関係を示している.提案手法 では,撮影装置の焦点位置を変更しながら撮影した複数枚の画像を利用すること で,より鮮明な特定層の画像を推定する.



図 14 複数枚の撮影画像を用いた撮影画像の特定層抽出

4.2 光線強度の物理的性質による鮮明化処理の上界・下界制約

光線強度は非負値でなければならないという物理的な性質より,撮影対象の全ての位置 \mathbf{k} のある位置 k から出た光線強度 w_j に関する制約を以下の式で表現できる.

$$w_k > 0, \ \forall \ k \in \mathbf{k} \tag{16}$$

下界制約を用いた鮮明化処理では,推定する撮影対象が式(16)で表現される非負値であるという制約を用いる.

一方,撮影対象の位置 k から出た光は提案手法の持つボケ特性により,撮像素子の複数の画素に入射する.そのため,撮像素子の位置 j に入射する光 o_j は,撮影対象の位置 k から出た光 w_k と位置 k から出た光が撮像素子の位置 j で観測される割合を示す P_{j,k} より以下の式で求めることができる.

$$o_j = P_{j,k} w_k \tag{17}$$

実際の撮影では図15に示すように撮影対象の複数の位置から出た光が観測され



図 15 撮像素子によって観測される光線強度

るため、撮像素子で観測される光線強度 o_i は以下の式で表現することができる.

$$o_{j} = P_{j,0}w_{0} + P_{j,1}w_{1} + \dots + P_{j,k}w_{k}$$
(18)

各項は下界制約により非負値であるため,以下の制約が成り立つ.

$$w_k \le \frac{o_j}{P_{j,k}} \tag{19}$$

上界制約を用いた鮮明化処理では,撮像素子によって観測される光線強度 o_jを用いて,式(19)により求まる最大輝度値の最小値を求め,上限値を制約に加えて撮影対象画像の推定を行う.

$$w_k \le \min_{j \in \mathbf{j}} \left(\frac{o_j}{P_{j,k}} \right) \tag{20}$$

4.3 理想的な撮影環境と異なる場合の鮮明化処理

実環境実験では,放物面鏡の製造時に発生する歪みや撮像素子の性質によって ボケ方に偏りが発生する.一例として,図16に示す撮影実験に使用する撮像素 子は外気に触れることによって劣化する現象を防ぐため,前面にカバーガラスが 存在する.シミュレーション環境において前面にガラスを設置した場合と設置し ない場合で撮影を行った結果を図17に示す.撮影画像からボケ方に差が出るこ



図 16 実環境実験において撮影に使用する撮像素子

とから,前面のカバーガラスによる屈折の影響により,撮影装置の特性が変化していることが分かる.

図18は,撮像素子の前面にカバーガラスが無い場合に観測した PSF の形状を, 図19は,撮像素子の前面に厚さ 1mm で屈折率 1.51 のガラスを配置した場合に 観測した PSF の形状を示している. PSF の形状は,光学装置全体が持つ歪みや 屈折の影響を受けた状態で観測されているため,計測した PSF を,鮮明化処理に 用いることで,撮像素子の前面にカバーガラスが無い場合と同様に,特定層の画 像を推定することができる.





(b) 撮像素子前面ガラス有り (a) 撮像素子前面ガラス無し 図 17 撮像素子前面のカバーガラスの有無による撮影画像の差



(a) 焦点位置のPSF

にずれた位置のPSF

(b) 焦点位置から奥行き方向 (c) 焦点位置から水平方向 にずれた位置のPSF

図 18 撮像素子前面にカバーガラスが無い場合に計測される PSF 形状



(b) 焦点位置から奥行き方向 (c) 焦点位置から水平方向 (a) 焦点位置のPSF にずれた位置のPSF にずれた位置のPSF 図 19 撮像素子前面にカバーガラスがある場合に計測される PSF 形状

5. 提案手法による撮影実験

本章では,層構造物体を撮影対象として用いることで,提案する撮影装置が特 定の層のみを撮影することが可能な非常に浅い被写界深度を持つことを確認する. はじめに,シミュレーション環境で撮影装置を構築し,層の間隔が非常に狭い2 層構造物体の撮影シミュレーションを行う.また,PSFの取得を行い,4章で述 べた鮮明化処理を行うことで,より鮮明に特定層のみを抽出できることを確認す るとともに,上界下界制約を加えた最適化の有効性を確認する.次に,実環境で 撮影装置を構築し,シミュレーション環境同様に層間隔の狭い2層構造物体の特 定の層に焦点を合わせて撮影することで,特定の層の撮影が可能であることを確 認する.実環境でのPSF取得には撮影対象を自在に移動させるためロボットアー ムを用いて撮影を行い,鮮明化処理に利用する.最後に,シミュレーション環境 と実環境との差異について述べ,実験結果の考察を行う.

5.1 シミュレーション環境実験

シミュレーション環境では、本研究で提案する撮影装置が非常に浅い深度を持 つことを確認するために、まず、層間隔の狭い撮影対象のそれぞれの層に焦点を 合わせ撮影する.次に、複数の撮影画像から特定の層のみを鮮明に撮影できるか を確認する.

本実験ではレイトレーシングソフトの POV-RAY[31] を用いてシミュレーショ ンを行う. POV-RAY を用いて,図 20 に示すように撮像素子上の各画素に前方か ら入射する全方向からの光線の強度を記録する.各画素に入射する光線強度の総 和を各画素の値として利用することで撮影シミュレーションを行う.

5.1.1 実験条件

撮影実験では,図21に示すように同じ形状の放物面鏡2枚を向かい合わせに 設置し,一方の焦点位置に撮影対象,もう一方の焦点位置に撮像素子の中心を 設置する.図22に撮影実験に使用する装置の構造を示す.放物面鏡の焦点距離



図 20 POV-RAY による撮影シミュレーション

を 65mm になるように設定し、それぞれの頂点と焦点を一致させるように配置 する. 放物面鏡の形状は焦点位置によって定まり、同じ形状の放物面鏡を向かい 合わせに設置しているため、放物面鏡の高さは焦点距離の半分となり、放物面鏡 の最大直径は式 (5) より約 184mm となる. 2 枚の放物面鏡内部には、光源から の直接光を取り除くために、直径 20mm のマスクを取り付けている. 2 枚の放 物面鏡の焦点を通る軸を奥行き方向を示す Z 軸とし、撮像素子は Z 軸に直行する XY 平面に平行になるように配置する. 撮像素子上の画像は UV 軸で示し、焦点 を原点とし、U 軸と V 軸はそれぞれ X 軸、Y 軸の逆方向を示す. これは、撮影対 象が焦点位置を中心とした点対称で撮影されるためにである. 撮像素子はサイズ 20mm × 20mm(201 × 201 画素)で1 画素の間隔は 100µm に設定し、一方の放物 面鏡の焦点位置を中心に設置する. もう一方の焦点位置には撮影対象を設置し、 撮影対象から出た光を検出する.

5.1.2 PSF の取得

本研究では位置依存 PSF を用いた鮮明化処理を行うことで,幾何収差と他層 からのボケの映りこみを抑えた特定層のみの画像を推定する.撮像素子と同様



図 21 シミュレーション環境での撮影装置の概要



図 22 撮影装置の平面図および側面図

20mm × 20mm で 201 × 201 画素の範囲の位置依存 PSF を計測し鮮明化処理に使用する. PSF の計測には,撮像素子上の 40401 点に入射する光線をレイトレーシ

ングにより計測するため、1枚の画像を作成するために1時間程度(Intel Core i7-3970X CPU @ 3.50GHz × 12, GeForce GTX680)の時間がかる.

そこで,放物面鏡は図21で定義したZ軸を中心とする円対称であることから, PSFの計測はX軸方向とZ軸方向のみに移動させながらPSFの取得を行い,取 得したPSFをZ軸中心に回転させることで位置依存PSFの計測を行う.また, 点光源の位置に対応した点を中心とした61×61画素のみを計測に用いることで, PSFの作成に必要な時間を低減する.

PSF 計測の際には点光源を Z 軸を中心に 0.01mm 間隔で 20mm の位置まで計 測する.鮮明化処理に使用する PSF は,計測済みの PSF を用いて, Z 軸からの距 離と Z 軸中心の回転量によって移動させて再現した PSF を用いる.Z 軸からの距 離に対応する PSF が計測されていない場合,近い距離で計測した 2 種類の PSF を近さの割合で足し合わせた線形補間によって近似的に PSF を再現している.

はじめに、点光源を奥行き方向(Z軸)方向に移動させながら撮影を行った際 のボケ方の変化を図23に示す.グラフはPSFのボケ形状を示すもので、撮像素 子の各画素に影響する光の強度の割合を示している.グラフより、点光源がZ軸 方向に0.1mm移動するだけで大きくボケていることから、提案装置が非常に浅 い被写界深度を実現できていることが分かる.次に、点光源を焦点位置から、撮 像素子の水平方向であるX軸方向に移動させながら撮影を行った際のボケ方の変 化を図24に示す.グラフは、図23のグラフ同様、PSFのボケの形状を示すもの で撮像素子の各画素に影響する光の強度の割合を示し、点光源が焦点から撮像素 子に水平方向に移動していくため、光の強度のピークが撮像素子のU軸方向に移 動している.水平方向のPSFは2.0mm移動した点でボケが大きくなるが、奥行 き方向の移動に対してボケ量が少ないため、本撮影装置は他の奥行きに存在する 層を大きくぼかして特定層のみを鮮明に撮影することが可能となる.しかしなが ら、レンズ付きカメラ等の通常の撮影装置に比べ撮像素子における水平方向のボ ケ度合いを示す幾何収差が大きく、撮影画像周辺でボケが発生しやすいことも確 認できる.

図 25 に各位置の PSF の周波数成分を示す. 焦点位置の PSF を示す X = 0.0mm, Z = 0.0mm の位置の PSF 形状は焦点位置にある撮像素子の一点でのみ観測され

27



図 23 焦点から Z 軸方向に点光源を移動させたときに観測される PSF の形状(左図: U 軸方向の PSF の断面図,右図:観測された PSF)



図 24 焦点からX軸方向に点光源を移動させたときに観測される PSFの形状(左図:U軸方向の PSFの断面図,右図:観測された PSF)

るため,すべての周波数成分が観測されている.X軸に沿った撮像素子の水平方 向への移動に対しては,高周波成分が少なくなりボケの形状が広がっていること



図 25 各位置で観測された PSF の周波数成分

が確認できるが、高周波成分の低下に規則性が見られない.また、奥行き方向を 示すZ軸に沿った移動に対しては、ドーナツ形状にボケていることから周波数の 分布に規則性がなく、PSFに含まれる周波数成分はPSFの位置によって大きく 変化していることが分かる.このことより、提案装置は位置に依存かつ規則性の ないPSFを持っていることが確認できる.

5.1.3 実験結果

本撮影実験に使用する撮影対象を図 26 に示す.撮影対象は層間隔が 0.5mm の 2 層構造物体で,上層に図 26(b) に示す,"蝶々"の画像と,下層に図 26(c) に示 す"ABCD"という文字の画像を使用する.それぞれの画像は撮像素子と同様 20mm × 20mm で,上層の画像のみ透過率を 50% に設定している.図 27 はそれ



(a) 撮影対象の概観





(b) 上層画像 (c) 下層画像 図 26 シミュレーション環境実験に使用する撮影対象



(a) 撮影対象の上層に焦点を合わせて 撮影した画像



(b) 撮影対象の下層に焦点を合わせて 撮影した画像

図 27 提案撮影装置による撮影結果

ぞれの層に焦点を合わせて撮影した画像であり、上層下層それぞれの画像を撮影 できていることから、提案する撮影装置が非常に浅い被写界深度持つことが確認 できるが、画像の周辺でのボケが発生しやすく、他層のボケも映りこむことが分 かる.

次に、位置依存 PSF を用いた鮮明処理を行う.はじめに、図 28 に各層に焦点 を合わせて撮影した2枚の画像を用いて, 上界・下界制約の条件を変えて鮮明化 処理を行った結果を示す.図29は1画素で観測されうる最大輝度値を"1"として、 撮影対象に用いた画像と撮影画像から最適化により推定した鮮明化処理結果との 差を示している.



図 28 各層に焦点を合わせて撮影した2枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果



図 29 撮影対象画像と2枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果との誤差

図 28(a) は上界・下界の制約を与えず鮮明化処理を行った結果を示してる.異 なる層からボケて映りこむ画像や撮影画像周辺での幾何収差によるボケを軽減で きることが確認できる.図 28(b) は光線強度は負の値にならないという条件であ る下界制約を追加して鮮明化処理を行った結果で、ノイズが軽減されており、よ



図 30 最適化に用いる画像の撮影位置

り鮮明な特定層抽出ができていることがわかる.図 28(c) は PSF と撮影画像から 算出できる上界制約も追加した鮮明化処理の結果を示している.上界・下界制約 を用いた鮮明化処理では、下層の水平方向のボケである幾何収差を低減させるこ とができていることが分かる.しかし、鮮明化処理に用いる PSF は上層の画像に よって遮られた光線を考慮していないため、下層の上限値が小さく算出され、そ の影響によりボケが上層に映りこんだ画像が推定されるため、推定画像のノイズ が現れていると推測される.そこで、上層のみに上界制約を与え最適化を行った 結果を図 28(d) に示す.上層の映りこみの影響を低減させることができたが、下 層の幾何収差によるボケを低減することができず、下界制約を与え最適化を行っ た図 28(b) と同等の鮮明化結果であることが分かる.

次に,図 30 に示すように,焦点位置を 0.25mm 間隔でずらした 5 枚の撮影画像(それぞれの層に焦点を合わせたときに撮影した 2 枚の画像に加え、上層と下層の間や,上層の上,下層の下に焦点を合わせた 3 枚の画像)を入力として用い 鮮明化処理を行った.

図 31 に 5 枚の画像を用いて上界・下界制約の条件を変えて鮮明化処理を行った 結果を示す.図 32 は 1 画素で観測されうる最大輝度値を"1"として,撮影対象に 用いた画像と撮影画像から最適化により推定した鮮明化処理結果との差を示して いる.図31(a)は最適化を行う際に制約を用いず鮮明化処理を行った結果である. 撮影した2枚の画像のみを用いた鮮明化処理と比べ,ノイズやボケを取り除けて いることが分かる.図31(b)は下界制約のみを用いて推定した結果で,下層画像 の影響により上層で観測されるボケを軽減できていることが分かる.しかし,下 界・上界制約を用いた鮮明化結果は,図31(c)に示すように下層画像にノイズが 発生し,上層に下層の画像が映り込んで推定されている.これは,2枚の撮影画 像を用いたときと同様,上層によって遮蔽された光線を考慮していないため,上 界制約の上限値が小さく算出されるためである.図31(d)は下界制約と上層にの み上界制約を用いて鮮明化を行った結果であり,下界制約のみを用いて推定した 結果と同等の鮮明化結果であるが,上界・下界制約を行った際の下層に現れるノ イズを低減しており,上層への映りこみを低減している.

次に、SAD(Sum of Absolute Difference)とSSD(Sum of Squared Difference)を 用いて鮮明化処理の効果を定量的に評価する.SADとSSDの計算には撮影に用 いた撮影対象の各層の真値画像と,撮影画像から推定された各層の画像を用いる. 表3は、1 画素で観測されうる最大輝度値を"1"として,各層の撮影画像と鮮明化 処理によって推定された各層の画像に対するSADとSSDの値を示す.制約を用 いない最適化による鮮明化処理を行うことで、単純な撮影画像と比べ上層・下層 の映り込みが軽減され、また、幾何収差により発生する画像周辺のボケが低減さ れていることが分かる.特に、上層によって光が遮られる下層を撮影した際には、 鮮明化処理によって上層の映り込みが低減され、撮影対象の画像との相関値が高 くなっていることが分かる.しかし、図28(a)より他層の影響によりノイズのよ うな模様が生成されていることが分かる.これは、推定画像の一部が負の値とし て推定されることで、撮影対象から出た光線強度とPSF、観測画像の関係を示す 式(18)を保つために、他の位置の光線強度が、より大きい値に推定されるためで ある.

下界制約を用いた鮮明化処理では、制約を加えることで光強度が負の値になら ないため、他層からの影響で計測されていたノイズが軽減され、より鮮明な特定 層のみの画像を得られていることが分かる.

下界制約と上界制約を用いた鮮明化処理では、下界制約を用いた鮮明化処理と



図 31 各層とその前後の奥行きに焦点を合わせて撮影した5枚の撮影画像を用い た鮮明化処理結果



図 32 撮影対象画像と5枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果との誤差

比べ,撮影対象との相関値が低い.これは,PSF が上層の遮蔽の影響を考慮して いないことにより,撮影画像から推定される上限値が実際の光線強度より小さく 算出されるためである.そのため,2枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果(図

表3批	最影対象の	の各層(の画像と	鮮明化処理に	よる	,推定画像	の類似度
-----	-------	------	------	--------	----	-------	------

	上	上層 下層		層
	SAD	SSD	SAD	SSD
撮影画像		367	4086	1134
2枚の撮影画像を用いた結果				
上界・下界制約なし鮮明化処理	3193	194	4512	863
下界制約のみ用いた鮮明化処理	810	45	1927	709
上界・下界制約を用いた鮮明化処理	984	88	1888	880
下界制約と上層にのみ上界制約を用いた鮮明化処理	789	47	1962	702
5枚の撮影画像を用いた結果				
上界・下界制約なし鮮明化処理	2212	101	3560	717
下界制約のみ用いた鮮明化処理	702	37	1384	592
上界・下界制約を用いた鮮明化処理	903	73	1746	888
下界制約と上層にのみ上界制約を用いた鮮明化処理	692	39	1530	584

28(c))と、5枚の撮影画像を用いた鮮明化処理結果(図 31(c))のどちらにも下層の 映り込みが上層に現れていることが分かる.下界制約に加え上層のみに上界制約 を適用した鮮明化処理では表3より、上層の鮮明化ができていることから、下層 からの映り込みを低減できていることが分かる.この結果より、本研究で提案す る鮮明化処理を用いることで幾何収差の影響を取り除き、他層から映りこみを低 減した画像を推定可能であることが確認できる.

5.2 実環境実験

実環境実験では、図 33 に示す放物面鏡と撮像素子を用いたプロトタイプ撮影 システムを構築し、シミュレーション環境実験と同様の2層構造物体を撮影対象 とする.本実験では、図 34 に示す比較的開口数が高く被写界深度の浅いレンズ (SCHNEIDER F0.95 Fast C-Mount Lens, F0.95)を接写用エクステンダーを用



図 33 構築した提案プロトタイプ撮影システム



図 34 比較対象として使用するレンズを用いた撮影システム



図 35 提案プロトタイプ撮影システムの構成

いて取り付けた装置およびプロトタイプ撮影システムによる撮影結果と比較する ことで、実際の環境においても提案撮影システムが非常に浅い被写界深度を持つ ことを確認する.また、構築した撮影システムの PSF の計測を行い、鮮明化処理 を行うことでより鮮明な特定層抽出を行う.

5.2.1 撮影装置と方法

図 35 は本実験で使用する撮影装置(図 33)の構成を示しており,2枚の放物面 鏡の一方の焦点付近に撮像素子を設置し,もう一方の焦点付近に撮影対象設置す る.本撮影装置で使用する放物面鏡は内部に配置した物体が浮いて見える装置" Mirage"を使用し,外径は約147mmで放物面鏡の頂点付近に穴を開けている.撮 像素子は Point Grey 社の Grasshopper2(GS2-FW-14S5C-C,1,384×1036 画素, Sony ICX285 CCD, 画素サイズ 6.45µm×6.45µm)の外装を取り外し,レンズを 取り付けず撮像素子をむき出しの状態にして使用する.撮影対象に使用する光源 は液晶ディスプレイに使用される LED バックライトを使用し,光源の指向性を



(a) 点を印字したOHPシート

(b) 無地OHPシート





抑えるために, 白濁したプラスチックボードをバックライトの上に設置している. この光源を平行移動ステージ(HPS60-20X-M5)に取り付け, 光源の上に撮影対 象を設置し, 平行ステージを奥行き方向に移動させることで撮影対象に合わせる 焦点の位置を調整し撮影を行う.また, 光源からの直接の光を防ぐために2枚の 放物面鏡内部に, 直径50mmの光吸収シートを取り付けたマスクを設置する.

5.2.2 PSF の取得

鮮明化処理に用いる PSF の取得を行うために撮影対象を点光源を移動させな がら撮影する.本実験では非常に小さい範囲で発行する点光源を用意することが 困難であるため, PSF の計測には,点を印字した OHP シートを撮影することで 印字した点によって遮蔽される光線を計測し,PSF を算出する



図 38 PSFの計測範囲と PSF 計測に用いる OHP シートに印字する点のサイズ

図 36(a) に示す一点を印字した OHP シートを用いることで,一点によって遮蔽される光線を計測し図 36(b) に示す無地の OHP シートを撮影対象としてそれ ぞれ同一箇所で撮影する.図 37(a),(b) に示す 2 枚の撮影画像の差分を計算するこ とで PSF の取得を行う.

なお,撮像素子上の1画素は非常に小さく,1画素に対応する大きさの点を印 刷することが困難であることから,図38に示すように,撮像素子の40×40画素 (258µm×258µm)に対応するサイズの点を印刷したOHPシートを用いてPSF を取得し,鮮明化処理の実験では,縦横それぞれ元の画像の40分の1のサイズ の画像を用いて実験を行う.撮影したボケの光量の総和が"1"になるように正規 化することで,ある空間中の1点に対応するPSFを取得する.

図 39 は点を印字した OHP シートを焦点付近から奥行き方向,水平方向に移動 させたときの撮影画像である.図より奥行き方向に移動させた際のボケの形状が 円形状にボケず特定の方向にボケやすいという特徴を持っていることが確認でき る.これは,放物面鏡の精度が低いことや,撮像素子や撮影対象を焦点を中心と する位置に正確に配置することが困難であるためボケの形状が円対称にならない ためと考えられる.シミュレーション環境では放物面鏡が1つの軸を中心とする 完全な円対称であったため,奥行き方向の位置と中心からの距離を示す2軸に沿っ て点光源を移動させ PSF の取得を行ったが,実環境では,この問題により推定 する画素全ての PSF の計測を行うために3軸の移動が必要となる.そこで,実環 境での PSF の取得には図 40 に示すようにロボットアーム (VP-6242M, DENSO)



図 39 実環境実験において取得した PSF



図 40 撮影対象の移動に使用するロボットアーム

の先端に光源を取り付け、点が印字された撮影対象を撮影する.

5.2.3 実験結果

図 41 は実験に使用する撮影対象となる2層構造物体であり、2種類の画像を OHP シートに印刷し,層間隔が1.2mmになるように配置している.撮影装置の 光源に撮影対象を設置し、焦点位置を奥行き方向に変化させながら撮影した結果 を図 42, 図 43, 図 44 に示す. 図 42 は, 上層に遮蔽物としてエッジが多く高周波 成分が多く含まれる格子状のフェンス,下層に蝶々の画像を印刷した2層構造物 体を撮影した結果である.通常の撮影装置では図 42(a) に示すように,焦点を合



図 41 実環境撮影実験に使用する撮影対象

わせていない面は少しボケて撮影されるが、それぞれの層を分離して撮影することは困難である.しかし、図 42 に示す本提案撮影装置を用いた結果では、下層に焦点を合わせる事で、上層のフェンスの画像を大きくぼかして撮影できていることがわかる.

図 43 は、上層に遮蔽物としてフェンス、下層に文字を印刷した 2 層構造物体 を撮影した結果を示している.図 43 の結果は、図 42 の結果と同様、通常のカメ



ラを用いて撮影した結果と比べ、本撮影装置では焦点を合わせていない面の画像 を大きくぼかすことができ、下層に焦点を合わせた際は、フェンスの層を大きく ぼかし文字の面を撮影できていることから、非常に浅い被写界深度を実現できて いることが分かる.



図44では、上層の遮蔽物に蝶々の画像を用いることで、下層の文字が大きく 隠れている撮影対象を撮影した結果である.通常のカメラでは、蝶々が写るため 下層の画像を撮影することが困難であるが、本撮影装置では下層に焦点を合わせ た際に、上層の蝶々が大きくボケて下層の文字を撮影できている.

これらの撮影結果より非常に浅い被写界深度を持つ撮影装置が実現できている ことが分かる.しかし,撮影画像にはシミュレーション環境と同様に焦点を合わ せていない層の画像がボケて撮影されることや,放物面鏡の精度によるボケ形状 の偏りがあるため,フェンスなどがズレて滲んで撮影されることが確認できる.

実環境における鮮明化処理実験では,図45で示す撮影対象を撮影し,図46に 示す撮影画像と5.2.1項で述べた方法で取得したPSFを用いて鮮明化処理を行う. 図45(b),(c)に示す"A","B"の文字を印刷したOHPシートを上層と下層そ れぞれに約1.25mmの間隔を空けて設置した2層構造物体を撮影対象として用い る.図46はPSF取得時と同様に,"A","B"を印刷したOHPシートを利用し た2層構造物体撮影対象を撮影した画像と,無地のシートを貼り付けた撮影対象 を撮影した画像の2枚の画像の差分画像を,撮像素子40×40画素が1×1画素に 対応するようにサイズを調整した結果を示している.

図47は、鮮明化処理により推定した上層・下層画像である。推定した下層の画



図 45 鮮明化処理実験の撮影対象として用いる2層構造物体





(b) 下層に焦点を合わせて撮影

図 46 鮮明化処理実験に用いる撮影画像

像を見ると、撮影画像よりもボケの影響が少なく、"B"の文字の形状が分かるこ とから、幾何収差の影響を取り除けていることが分かる.しかし、上層の画像に 関しては、文字の形状の復元ができておらず、また、上層・下層の鮮明化処理後 の画像において画像にノイズや輝度ムラが発生している.これは、計測した PSF と同じ位置に撮影対象を配置することが困難であることや、ロボットアームを用 いたとしてもその繰り返し誤差が 20 μ m あり、撮影画像が数画素ずれて撮影さ れるため、2 層構造物体の撮影対象と PSF の計測用撮影対象を完全に一致して配 置することが困難であることが理由の一つとして考えられる.





(a) 上層

(b) 下層

図 47 鮮明化処理結果

5.3 シミュレーション環境実験と実環境実験の差異についての考察

シミュレーション環境では理想的な放物面鏡を用いた撮影を行うことができる が、実環境で使用する放物面鏡は、製造精度や研磨精度などにより歪みが存在す ることや、100%の反射率が再現できないことから、シミュレーション環境と異な りボケ方に偏りが発生するため、実環境ではシミュレーション環境ほどの鮮明さ で特定層のみを撮影することは困難である。特に本実験で使用した放物面鏡は、 市販されている"Mirage"という玩具をもとに製作を行っているため、放物面鏡 の精度が非常に悪く、シミュレーション環境を再現することは困難である。また、 内部に取り付けるマスクを固定するための梁が存在することや、撮像素子や撮影 対象を設置するための頂点付近に空けた穴の形状が真円でないこと、焦点位置を 目視することができないため撮像素子や撮影対象の厳密な位置合わせが行えない ことも撮影結果に影響を与えている。

6. まとめ

本論文では,正対する放物面鏡を用いた狭被写界深度撮影装置および,位置依存 PSF に基づき,撮影画像から特定層のみを推定する手法を提案した.提案した 装置を用いることで顕微鏡などのレンズを用いた撮影装置では困難な広範囲な撮 影ができ,複数視点からの画像を用いて開口数を大きくする合成開口法と比べ, 撮影装置が単純で,画像処理を用いずに高開口撮影が可能であることが特徴であ る.提案した撮影装置は撮影対象が焦点位置から奥行き方向に移動すると大きく ボケ,水平方向の移動では少しボケるという特性を持ち,この提案装置特有の位 置依存 PSF および,光線強度に関する物理法則による制約条件を用いた最適化 により,鮮明な特定層のみの抽出を行った.

シミュレーション環境実験では,層間隔の狭い2層構造物体を撮影対象とし, それぞれの層に焦点を合わせて撮影した際に,焦点を合わせたの層以外が大きく ボケた撮影画像が得られることを確認した.また,PSFの計測を行い,位置に依 存した PSFを持つこと確認するとともに,それを鮮明化処理に用いることで,他 層からの映りこみや幾何収差によるボケを取り除いた特定層のみを抽出した画像 が推定できることを示した.実環境実験では,提案する撮影装置を構築し,比較 的浅い被写界深度を持つカメラレンズを取り付けた撮影装置と比較することで非 常に浅い被写界深度撮影が実現できていることを確認した.また,PSFの計測を 行い,鮮明化処理を行うことで,下層の画像の幾何収差によるボケを軽減した推 定画像を示した.

今後の課題として,鮮明化処理の推定精度向上のために他層の影響を考慮した 鮮明化処理を行う必要がある。また,実環境では,鮮明化処理により推定した撮 影対象の光線強度に大きなムラが発生していることや,上層の推定画像の幾何収 差が取り除けていないことから,撮影装置の撮像素子・放物面鏡・撮影対象の位 置を正確に位置合わせした PSF の取得を行い,鮮明化処理による推定画像の精 度向上が必要となる.

46

謝辞

本研究の全過程を通して,懇切なる御指導,御鞭撻を賜りました視覚情報メディ ア研究室横矢直和教授に心より感謝致します.また、,本研究を進めるにあたり, 有益な御助言,御鞭撻を頂いた光メディアインタフェース研究室向川康博教授に 厚く御礼申し上げます.そして,本研究の遂行にあたり,始終暖かい御指導をし て頂いた視覚情報メディア研究室佐藤智和准教授に深く感謝致します.また,本 研究の行うにあたり,的確な御助言や御指導御指導を頂きました視覚情報メディ ア研究室河合紀彦助教に心より感謝いたします.そして,本研究を通じて,貴重 な御助言を頂いた光メディアインタフェース研究室青砥隆仁氏に深く感謝いたし ます.特に,佐藤智和准教授,河合紀彦助教,青砥隆仁氏には,本研究の着想お よびテーマ設定から研究の遂行,原稿執筆,発表練習,学内プロジェクトの遂行 など,長期にわたり多くの御指導を頂き深く感謝致します.

また,研究室での生活を支援して頂いた,視覚情報メディア研究室石谷由美女 史,南あずさ女史,光メディアインタフェース登 淑恵女史に厚く御礼申し上げま す.さらに,研究室のみならず研究室生活全般においてお世話になりました視覚 情報メディア研究室の諸氏に深く感謝いたします.そして,本研究のテーマのも ととなり,研究の遂行に関して明るく道を照らして頂いた放物面鏡に厚く御礼申 し上げます.最後に,研究活動だけでなく長い学生生活において温かく見守って くださいました両親をはじめ,大学院生活に関わった全ての方々に感謝の意を表 します.

47

参考文献

- [1] M. Minsky. Microscopy apparatus, December 19 1961. US Patent 3,013,467.
- [2] J. G. White, W. B. Amos, and M. Fordham. An evaluation of confocal versus conventional imaging of biological structures by fluorescence light microscopy. *The Journal of cell biology*, Vol. 105, No. 1, pp. 41–48, 1987.
- [3] T. Tanaami, S. Otsuki, N. Tomosada, Y. Kosugi, M. Shimizu, and H. Ishida. High-speed 1-frame/ms scanning confocal microscope with a microlens and nipkow disks. *Applied Optics*, Vol. 41, No. 22, pp. 4704–4708, 2002.
- [4] V. Vaish, B. Wilburn, N. Joshi, and M. Levoy. Using plane + parallax for calibrating dense camera arrays. In Proc. IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol. 1, pp. 2–9, 2004.
- [5] B. Wilburn, N. Joshi, V. Vaish, E. V. Talvala, E. Antunez, A. Barth, A. Adams, M. Horowitz, and M. Levoy. High performance imaging using large camera arrays. *ACM Trans. on Graphics*, Vol. 24, No. 3, pp. 765–776, 2005.
- [6] J. Unger, A. Wenger, T. Hawkins, A. Gardner, and P. Debevec. Capturing and rendering with incident light fields. Technical report, DTIC Document, 2003.
- [7] D. Lanman, D. Crispell, M. Wachs, and G. Taubin. Spherical catadioptric arrays: Construction, multi-view geometry, and calibration. pp. 81–88, 2006.
- [8] M. Levoy, B. Chen, V. Vaish, M. Horowitz, I. McDowall, and M. Bolas. Synthetic aperture confocal imaging. ACM Trans. on Graphics, Vol. 23, No. 3, pp. 825–834, 2004.
- [9] S. Tagawa, Y. Mukaigawa, J. Kim, R. Raskar, Y. Matsushita, and Y. Yagi. Hemispherical confocal imaging. *IPSJ Trans. on Computer Vision and Applications*, Vol. 3, pp. 222–235, 2011.

- [10] E. H. Adelson and J. Y. A. Wang. Single lens stereo with a plenoptic camera. *IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 14, No. 2, pp. 99–106, 1992.
- [11] R. Ng, M. Levoy, M. Brédif, G. Duval, M. Horowitz, and P. Hanrahan. Light field photography with a hand-held plenoptic camera. *Stanford University Computer Science Tech Report*, Vol. 2, No. 11, pp. 1–11, 2005.
- [12] T. Xue, M. Rubinstein, C. Liu, and W. T. Freeman. A computational approach for obstruction-free photography. ACM Trans. on Graphics, Vol. 34, No. 4, p. 79, 2015.
- [13] T. Georgiev, Z. Yu, A. Lumsdaine, and S. Goma. Lytro camera technology: theory, algorithms, performance analysis. In *Proc. SPIE Multimedia Content* and Mobile Devices, Vol. 8667, pp. 86671J–1–86671J–10, 2013.
- [14] D. Cho, M. Lee, S. Kim, and Y. W. Tai. Modeling the calibration pipeline of the lytro camera for high quality light-field image reconstruction. In *Proc. Int. Conf. on Computer Vision*, pp. 3280–3287, 2013.
- [15] J. S. Goldstein, I. S. Reed, and L. L. Scharf. A multistage representation of the wiener filter based on orthogonal projections. *IEEE Trans. on Information Theory*, Vol. 44, No. 7, pp. 2943–2959, 1998.
- [16] S. Kuthirummal, H. Nagahara, C. Zhou, and S. K. Nayar. Flexible depth of field photography. *IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 33, No. 1, pp. 58–71, 2011.
- [17] H. Nagahara, S. Kuthirummal, C. Zhou, and S. K. Nayar. Flexible depth of field photography. In Proc. European Conf. on Computer Vision, pp. 60–73, 2008.
- [18] R. Raskar, A. Agrawal, and J. Tumblin. Coded exposure photography: motion deblurring using fluttered shutter. ACM Trans. on Graphics, Vol. 25,

No. 3, pp. 795–804, 2006.

- [19] M. Subbarao and G. Surya. Depth from defocus: A spatial domain approach. Int. Journal of Computer Vision, Vol. 13, No. 3, pp. 271–294, 1994.
- [20] A. P. Pentland. A new sense for depth of field. *IEEE Trans. on pattern analysis and machine intelligence*, Vol. 9, No. 4, pp. 523–531, 1987.
- [21] A. Veeraraghavan, R. Raskar, A. Agrawal, A. Mohan, and J. Tumblin. Dappled photography: Mask enhanced cameras for heterodyned light fields and coded aperture refocusing. *ACM Trans. on Graphics*, Vol. 26, No. 3, pp. 69–1–69–12, 2007.
- [22] A. Levin, R. Fergus, F. Durand, and W. T. Freeman. Image and depth from a conventional camera with a coded aperture. ACM Trans. on Graphics, Vol. 26, No. 3, pp. 70–1–70–9, 2007.
- [23] C. Zhou, S. Lin, and S. Nayar. Coded aperture pairs for depth from defocus. In Proc. IEEE Int. Conf. on Computer Vision, pp. 325–332, 2009.
- [24] H. Siedentopf and R. Zsigmondy. Über sichtbarmachung und grössenbestimmung ultramikroskopischer teilchen mit besonderer anwendung auf goldrubingläser. Vol. 10, pp. 1–39, 1903.
- [25] N. Jährling, K. Becker, and H. U. Dodt. 3d-reconstruction of blood vessels by ultramicroscopy. *Organogenesis*, Vol. 5, No. 4, pp. 227–230, 2009.
- [26] K. Tanaka, Y. Mukaigawa, H. Kubo, Y. Matsushita, and Y. Yagi. Recovering inner slices of layered translucent objects by multi-frequency illumination. *IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2016.
- [27] S. Adhya and J. Noé. A complete ray-trace analysis of the 'mirage' toy. In Proc. SPIE Int. Topical Meeting on Education and Training in Optics and Photonics, pp. 966518–1–966518–7, 2007.

- [28] A. Butler, O. Hilliges, S. Izadi, D. Molyneaux, and D. Kim. Vermeer: direct interaction with a 360° viewable 3d display. In Proc. ACM Symposium on User Interface Software and Technology, pp. 569–576, 2011.
- [29] J. O. Castañeda. Foucault, wire, and phase modulation tests. Optical Shop Testing, Third Edition, pp. 275–316, 1992.
- [30] D. Gabay and B. Mercier. A dual algorithm for the solution of nonlinear variational problems via finite element approximation. *Computers & Mathematics with Applications*, Vol. 2, No. 1, pp. 17–40, 1976.
- [31] Persistence of vision raytracer. http://www.povray.org/.